



INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Optical fibres –

Part 1-45: Measurement methods and test procedures – Mode field diameter

Fibres optiques –

Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Diamètre du champ de mode

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.180.10

ISBN 978-2-8322-4979-6

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD	5
1 Scope	7
2 Normative references	7
3 Terms and definitions	7
4 General consideration about mode field diameter	7
5 Reference test method	8
6 Apparatus	8
6.1 General	8
6.2 Light source	8
6.3 Input optics	9
6.4 Input positioner	9
6.5 Cladding mode stripper	9
6.6 High-order mode filter	9
6.7 Output positioner	9
6.8 Output optics	9
6.9 Detector	9
6.10 Computer	9
7 Sampling and specimens	10
7.1 Specimen length	10
7.2 Specimen end face	10
8 Procedure	10
9 Calculations	10
9.1 Basic equations	10
9.2 Method A – Direct far-field scan	10
9.3 Method B – Variable aperture in the far field	11
9.4 Method C – Near-field scan	11
10 Results	12
10.1 Information available with each measurement	12
10.2 Information available upon request	12
11 Specification information	12
Annex A (normative) Requirements specific to method A – Mode field diameter by direct far-field scan	14
A.1 Apparatus	14
A.1.1 General	14
A.1.2 Scanning detector assembly – Signal detection electronics	14
A.1.3 Computer	14
A.2 Procedure	15
A.3 Calculations	15
A.3.1 Determine folded power curve	15
A.3.2 Compute the top (T) and bottom (B) integrals of Equation (1)	15
A.3.3 Complete the calculation	15
A.4 Sample data	16
Annex B (normative) Requirements specific to method B – Mode field diameter by variable aperture in the far field	17
B.1 Apparatus	17

B.1.1	General	17
B.1.2	Output variable aperture assembly	17
B.1.3	Output optics system	18
B.1.4	Detector assembly and signal detection electronics	18
B.2	Procedure	18
B.3	Calculations	18
B.3.1	Determine complementary aperture function	18
B.3.2	Complete the integration	19
B.3.3	Complete the calculation	19
B.4	Sample data	19
Annex C (normative)	Requirements specific to method C – Mode field diameter by near-field scan	20
C.1	Apparatus	20
C.1.1	General	20
C.1.2	Magnifying output optics	20
C.1.3	Scanning detector	20
C.1.4	Detection electronics	21
C.2	Procedure	21
C.3	Calculations	21
C.3.1	Calculate the centroid	21
C.3.2	Fold the intensity profile	22
C.3.3	Compute the integrals	22
C.3.4	Complete the calculation	22
C.4	Sample data	23
Annex D (normative)	Requirements specific to method D – Mode field diameter by optical time domain reflectometer (OTDR)	24
D.1	General	24
D.2	Apparatus	24
D.2.1	OTDR	24
D.2.2	Optional auxiliary switches	24
D.2.3	Optional computer	25
D.2.4	Test sample	25
D.2.5	Reference sample	25
D.3	Procedure	25
D.3.1	Orientation and notation	25
D.4	Calculations	26
D.4.1	Reference fibre mode field diameter	26
D.4.2	Computation of the specimen mode field diameter	27
D.4.3	Validation	27
Annex E (informative)	Sample data sets and calculated values	29
E.1	General	29
E.2	Method A – Mode field diameter by direct far-field scan	29
E.3	Method B – Mode field diameter by variable aperture in the far field	30
E.4	Method C – Mode field diameter by near-field scan	30
Figure 1	– Transform relationships between measurement results	8
Figure A.1	– Far-field measurement set	14
Figure B.1	– Variable aperture by far-field measurement set	17

Figure C.1 – Near-field measurement set-ups	20
Figure D.1 – Optical switch arrangement	25
Figure D.2 – View from reference fibre A	26
Figure D.3 – View from reference fibre B	26
Figure D.4 – Validation example – Comparison of methods.....	27
Table E.1 – Sample data, method A – Mode field diameter by direct far-field scan.....	29
Table E.2 – Sample data set, method B – Mode field diameter by variable aperture in the far field	30
Table E.3 – Sample data set, method C – Mode field diameter by near-field scan.....	30

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL FIBRES – Part 1-45: Measurement methods and test procedures – Mode field diameter

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60793-1-45 has been prepared by subcommittee 86A: Fibres and cables, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2001. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) improvement of the description of measurement details for B6 fibre;
- b) correction of Equations (1), (2),(5) and (6);
- c) correction of Table E.1, Table E.2 and Table E.3.

The text of this International Standard is based on the following documents:

CDV	Report on voting
86A/1758/CDV	86A/1802/RVC

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60793 series, published under the general title *Optical fibres*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

OPTICAL FIBRES –

Part 1-45: Measurement methods and test procedures – Mode field diameter

1 Scope

This part of IEC 60793 establishes uniform requirements for measuring the mode field diameter (MFD) of single-mode optical fibre, thereby assisting in the inspection of fibres and cables for commercial purposes.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60793-1-40:2001, *Optical fibres – Part 1-40: Measurement methods and test procedures – Attenuation*

IEC 60793-2, *Optical fibres – Part 2: Product specifications – General*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	35
1 Domaine d'application	37
2 Références normatives	37
3 Termes et définitions	37
4 Considérations générales concernant le diamètre du champ de mode	37
5 Méthode d'essai de référence	38
6 Appareillage	38
6.1 Généralités	38
6.2 Source lumineuse	38
6.3 Système optique d'entrée	39
6.4 Dispositif de positionnement d'entrée	39
6.5 Extracteur de modes de gaine	39
6.6 Filtre des modes d'ordre supérieur	39
6.7 Dispositif de positionnement de sortie	39
6.8 Dispositif optique de sortie	39
6.9 Détecteur	39
6.10 Calculateur	40
7 Échantillonnage et échantillons à l'essai	40
7.1 Longueur de l'échantillon à l'essai	40
7.2 Surface d'extrémité de l'échantillon à l'essai	40
8 Mode opératoire	40
9 Calculs	40
9.1 Équations de base	40
9.2 Méthode A – Exploration directe en champ lointain	40
9.3 Méthode B – Ouverture variable en champ lointain	41
9.4 Méthode C – Exploration en champ proche	42
10 Résultats	42
10.1 Informations disponibles pour chaque mesure	42
10.2 Informations disponibles sur demande	43
11 Informations à mentionner dans la spécification	43
Annexe A (normative) Exigences spécifiques à la méthode A – Diamètre du champ de mode par la technique de l'exploration directe en champ lointain	44
A.1 Appareillage	44
A.1.1 Généralités	44
A.1.2 Ensemble détecteur à balayage – Système électronique de détection des signaux	44
A.1.3 Calculateur	45
A.2 Mode opératoire	45
A.3 Calculs	45
A.3.1 Déterminer la courbe de puissance symétrisée par moyennes des écarts	45
A.3.2 Calculer l'intégrale du numérateur (T) et l'intégrale du dénominateur (B) de l'Équation (1)	45
A.3.3 Effectuer le calcul	46
A.4 Données sur échantillon	46

Annexe B (normative) Exigences spécifiques à la méthode B –Diamètre du champ de mode par la technique de l'ouverture variable en champ lointain.....	47
B.1 Appareillage.....	47
B.1.1 Généralités.....	47
B.1.2 Ensemble à ouvertures variables de sortie.....	47
B.1.3 Dispositifs optiques de sortie.....	48
B.1.4 Ensemble détecteur et dispositif électronique de détection des signaux.....	48
B.2 Mode opératoire.....	48
B.3 Calculs.....	49
B.3.1 Déterminer la fonction complémentaire d'ouverture.....	49
B.3.2 Effectuer l'intégration.....	49
B.3.3 Effectuer le calcul.....	49
B.4 Données sur échantillon.....	49
Annexe C (normative) Exigences spécifiques à la méthode C – Diamètre du champ de mode par la technique de l'exploration en champ proche.....	50
C.1 Appareillage.....	50
C.1.1 Généralités.....	50
C.1.2 Ensembles optiques de grossissement.....	50
C.1.3 Détecteur de balayage.....	51
C.1.4 Systèmes électroniques de détection.....	51
C.2 Mode opératoire.....	51
C.3 Calculs.....	52
C.3.1 Calculer le barycentre.....	52
C.3.2 Symétriser le profil d'intensité.....	52
C.3.3 Calculer les intégrales.....	52
C.3.4 Effectuer le calcul.....	53
C.4 Données sur échantillon.....	53
Annexe D (normative) Exigences spécifiques à la méthode D – Diamètre du champ de mode par réflectomètre optique dans le domaine temporel (RODT).....	54
D.1 Généralités.....	54
D.2 Appareillage.....	54
D.2.1 RODT.....	54
D.2.2 Commutateurs auxiliaires facultatifs.....	54
D.2.3 Calculateur facultatif.....	55
D.2.4 Échantillon d'essai.....	55
D.2.5 Échantillon de référence.....	55
D.3 Mode opératoire.....	55
D.3.1 Orientation et notation.....	55
D.4 Calculs.....	56
D.4.1 Diamètre du champ de mode de la fibre de référence.....	56
D.4.2 Calcul du diamètre du champ de mode de l'échantillon à l'essai.....	57
D.4.3 Validation.....	57
Annexe E (informative) Ensemble de données sur échantillon et valeurs calculées.....	59
E.1 Généralités.....	59
E.2 Méthode A – Diamètre du champ de mode par exploration directe en champ lointain.....	59
E.3 Méthode B – Diamètre du champ de mode par la méthode de l'ouverture variable en champ lointain.....	59
E.4 Méthode C – Diamètre du champ de mode par exploration en champ proche.....	60

Figure 1 – Relations de transformées entre les résultats de mesure	38
Figure A.1 – Montage de mesure en champ lointain.....	44
Figure B.1 – Montage de mesure par ouverture variable en champ lointain	47
Figure C.1 – Montage de mesure en champ proche	50
Figure D.1 – Disposition de commutation optique	55
Figure D.2 – Vue de la fibre de référence A	56
Figure D.3 – Vue de la fibre de référence B	56
Figure D.4 – Exemple de validation: comparaison de méthodes	57
Tableau E.1 – Données sur échantillon, méthode A – Diamètre du champ de mode par exploration directe en champ lointain	59
Tableau E.2 – Données sur échantillon, méthode B – Diamètre du champ de mode par la méthode de l'ouverture variable en champ lointain	60
Tableau E.3 – Données sur échantillon, méthode C – Diamètre du champ de mode par exploration en champ proche	60

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

FIBRES OPTIQUES –

Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Diamètre du champ de mode

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60793-1-45 a été établie par le sous-comité 86A: Fibres et câbles, du comité d'études 86 de l'IEC: Fibres optiques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2001. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) amélioration de la description des détails relatifs à la mesure de la fibre de catégorie B6;
- b) correction des Équations (1), (2), (5) et (6);
- c) correction du Tableau E.1, Tableau E.2 et Tableau E.3.

Le texte de la présente Norme internationale est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
86A/1758/CDV	86A/1802/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme internationale.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60793 publiées sous le titre général *Fibres optiques*, peut être consultée sur le site Internet de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

FIBRES OPTIQUES –

Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Diamètre du champ de mode

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60793 établit des exigences uniformes pour mesurer le diamètre du champ de mode (DCM) d'une fibre optique unimodale, contribuant ainsi au contrôle des fibres et câbles à des fins commerciales.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60793-1-40:2001, *Fibres optiques – Partie 1-40: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Affaiblissement*

IEC 60793-2, *Fibres optiques – Partie 2: Spécifications de produits – Généralités*